

国際コンフェレンス（特許とイノベーション、2008年12月）への論文プロポーザル投稿のご案内

一橋大学イノベーション研究センターと経済産業研究所は、今年の12月19日と20日に応用計量経済学会*の国際コンフェレンス（特許とイノベーション：“Patent and Innovation”）をホストいたします。実証的な研究のみならず理論的な研究も歓迎します。

場所：一橋大学 佐野書院

日時：2008年 12月19日(金)と20日(土)

テーマ：特許のみならず著作権、商標など他の知財とイノベーションの関連についての論文も歓迎します。イノベーションを促進する知財制度の設計を分析する論文を特に歓迎します（例は別添の1にあります）。

基調講演：カリフォルニア大学の Bronwyn Hall 教授、ミュンヘン大学の Dietmar Harhoff 教授、一橋大学の小田切宏之教授 他

後援 日本知財学会他

スケジュール：9月24日までに Extended abstract を提出して頂ければ、そのレフェリーをサイエンティフィック・コミティー（メンバーは別添2）が行い、審査を通った場合には完成論文はコンフェレンスで発表して頂くことが可能となります。

論文プロポーザル提出先：

http://www.aea-eu.com/2008Tokyo/UK/index.asp?id_colloque=61&lang=UK&link=soumission

あるいは WWW.aea-eu.com/2008Tokyo にアクセスし、Send your proposal のキーを押す（仏語の入力画面となる場合、左側の submit を選択すれば、英語画面となる）。

ローカル委員会：

長岡貞男 一橋大学

青木玲子 一橋大学

和田哲夫 学習院大学教授

大湾秀雄 青山学院大学

Ivan Png National Singapore University

Keun Lee Seoul National University

注 応用計量経済学会（Applied econometric association, <http://www.aea-eu.com/uk/index.asp>）は、ヨーロッパに基盤がある国際学会組織で、知的財産とイノベーションを一つの重点として国際コンフェレンスを行い、成果を専門書や査読ジャーナルの特集号として発表してきています。

別添1 テーマの例

- Patent Examination System in the Face of Patent Explosions
 - Application of Patentability Standards (Novelty, Inventive Step, Utility & Technical Effects)
 - Patent Examination Requests and Examination Fees as Screening Device
 - Structure of Registration and Renewal Fees
- Use of Continuations and Divisions and their Value
- First to Invent Vs. First to Apply
- Patent Literature as Information Infrastructure for Inventions
- Efficiency of Community Patent Review, Opposition & Invalidity Trial System as Ex-post Quality Control
- Economic Effects of Research Tool Patents in Biotechnology
- Economic Effects of Software Patents
- Design of the Ownership Assignment Rule and Licensing Contract for Joint Research
- Design of the Reward to the Employee Inventors
- Market for Patent

別添2 Scientific Committee のメンバー・リスト

Bruno van POTTELSBERGHE, Solvay Business School (BE)

Reinhilde VEUGELERS, U. Leuven (BE)

Reiko AOKI, Hitostubashi U. (JP) and University of Auckland (NZ)

Michele CINCERA, ULB (BE)

Walter GARCIA-FONTES,

U. Pompeu Fabra (ES)

Aldo GEUNA, SPRU (UK)

Dominique GUELLEC, OECD (FR)

Bronwyn HALL U. of California (US)

Petr HANEL, U. Sherbrooke (CN)

Dietmar HARHOFF, München U. (DE)

Christian LEBAS, U. Lyon II (FR)

Georg LICHT, ZEW (DE)

Patrick LLERENA, BETA (FR)

Pierre MOHNEN, Maastricht U., MERIT (NL)

Sadao NAGAOKA, Hitostubashi U. (JP)

Henri SERBAT, AEA Paris (FR)

Don SIEGEL, U. California (US)

Max Von ZEDTWITZ, Tsinghua U. (CN)

Beth WEBSTER, U. Melbourne (AU)

Milad ZARIN-NEJADAN, U. Neuchatel (CH)

Ivan Png, National Singapore University (SN)

Keun Lee, Seoul National University (KR)